

- (A) positioning accuracy finer than 50  $\mu\text{m}$  or incremental steps finer than 6.4  $\mu\text{m}$ ,
- (B) individual die location read-out with X and Y axis position information during testing,
- (C) capability of testing devices having more than a total of 24 terminals, or
- (D) automatic water alignment,

(vii) test equipment, as follows:

(A) stored program controlled equipment specially designed for testing discrete semiconductor devices, including diodes, transistors, thyristors, photocells and solar cells, and unencapsulated dice, capable of

- (I) measurement of time intervals of less than 10 ns,
- (II) measurement of parameters such as  $f_T$ , S-parameters or noise figures at frequencies greater than 250 MHz,
- (III) resolution of currents of less than 100 pA, or
- (IV) measurement of spectral response at wavelengths outside the range from 450 to 950 nm,

(B) stored program controlled equipment specially designed for testing integrated circuits and assemblies thereof, capable of

- (I) functional truth table testing at a pattern rate greater than 2 MHz,
- (II) resolution of currents of less than 1 nA,
- (III) testing of integrated circuits not mounted on circuit boards, in packages having more than a total of 24 terminals, other than equipment specially designed for and dedicated to the testing of integrated circuits not included in item 1564, or
- (IV) measurement of rise times, fall times and edge placement times with a resolution of less than 20 ns,

(C) equipment specially designed for determining the performance of focal plane arrays at wavelengths of more than 1 200 nm, that use stored program controlled measurements or computer aided evaluation and that

- (I) use scanning light spot diameters of less than 0.12 mm,
- (II) are designed for measuring photosensitive performance parameters and for evaluating frequency response, modulation transfer function, uniformity of responsivity or noise, or
- (III) are designed for evaluating arrays capable of creating images of greater than 32 by 32 line elements, and

(D) specially designed for bubble memories, and

(viii) Class 10 filters and filter materials therefor, according to U.S. Federal Standard No. 290C for Class 10 clean air.

(A) a une précision de positionnement plus précise que 50  $\mu\text{m}$  ou un pas d'incrément inférieur à 6,4  $\mu\text{m}$ ,

(B) a un affichage individuel de l'emplacement des pastilles, soit l'information de position relative aux axes X et Y, au cours de l'essai,

(C) permet l'essai de dispositifs possédant plus de 24 sorties au total,

(D) a un alignement automatique des plaquettes,

(vii) équipement d'essai, à savoir:

(A) équipement à commande par programme enregistré spécialement conçu pour l'essai de dispositifs semi-conducteurs discrets, dont les diodes, transistors, thyristors, cellules photo-électriques et cellules solaires et de pastilles non encapsulées, qui permet, selon le cas:

- (I) la mesure d'intervalles de temps inférieurs à 10 ns,
- (II) la mesure de paramètres tels que  $f_T$ , paramètres S et facteurs de bruit, à des fréquences supérieures à 250 MHz,
- (III) la séparation de courants de moins de 100 pA,
- (IV) la mesure de la réponse spectrale à des longueurs d'onde situées en dehors de la gamme de 450 à 950 nm,

(B) équipement à commande par programme enregistré spécialement conçu pour l'essai de circuits intégrés et de leurs ensembles, qui permet, selon le cas:

- (I) l'exécution des essais fonctionnels, table de vérité, à une cadence de signal de plus de 2 MHz,
- (II) la séparation de courants de moins de 1 nA,
- (III) l'essai de circuits intégrés non montés sur carte, en boîtiers possédant plus de 24 sorties au total, à l'exclusion de l'équipement spécialement conçu pour l'essai de circuits non inclus dans l'article 1564, et consacré à celui-ci,
- (IV) la mesure des temps de montée, des temps de descente et des temps de positionnement des fronts avec un pouvoir séparateur de moins de 20 ns,

(C) équipement spécialement conçu pour déterminer la performance de réseaux à plan focal à des longueurs d'onde supérieures à 1 200 nm, employant des mesures à commande par programme enregistré ou une évaluation assistée par ordinateur et qui, selon le cas:

- (I) utilise des diamètres de la tache lumineuse de balayage de moins de 0,12 mm,
- (II) est conçu pour mesurer les paramètres de photosensibilité et pour évaluer la capacité de réponse en fréquence, la fonction de transfert de modulation, l'uniformité de la sensibilité ou le bruit,
- (III) est conçu pour évaluer des réseaux capables de créer des images de plus de 32 par 32 éléments de lignes,

(D) équipement spécialement conçu pour mémoire à bulles,

(viii) filtres de la classe 10 et leurs matériaux de filtrage lorsqu'ils se conforment aux exigences de la norme des États-Unis intitulée *U.S. Federal Standard No. 209C*, relatives à la production d'air d'une pureté de classe 10.